

JTAGホットプラグで再現性の低い不具合を撃墜！

開発工程の後半に発生する不具合の再現にお困りではありませんか？
 通電したままICE接続できるJTAGホットプラグ(活線挿抜)は、再現試験を不要にし、不具合対応の工数を大幅に引き下げるデバッグの切り札です。



NFC

モバイル端末向けシステムは高性能かつ複雑で、再現性の低い不具合が発生しがちな環境ですので、特にホットプラグの活用をおすすめします。

モバイル端末向けシステムの特徴

- ・多機能化と高性能化により多数の処理が並行実行される
- ・通信処理の種類が多い

例: 3G、GPS、WiFi、地デジ、NFC

- ・複数の開発部署で分担開発される
- ・製品サイクルが短く開発スケジュールが厳しい

考えられるリスク

- ・画面操作と各種通信の特定タイミングで発生する不具合
 →条件の特定に必要な工数が予測できない！
- ・他部署が開発した機能が関係した不具合
 →処理がブラックボックスで調査が困難！

不具合は開発工程の終盤に発生するため
 スケジュール調整は困難を極めます。

さあリスクに備えましょう

EJSCATTのJTAGホットプラグ機能を使えば、
 不具合が起きたそのときに通電したままICE
を接続し調査を行うことが可能です。

●ホットプラグ対応製品

- Atom シリーズ
- RX600 シリーズ
- ARM シリーズ

どうしても
再現できない

納品日が迫って
いるのに



EJSCATTホットプラグシステム構成 (価格は税別)

対応プロセッサ	EJSCATT 本体	WATCHPOINT ソフトウェアデバッグ	オプションアダプタ	年間サポート
Atom	EJSCATT (SCD001J)	WP DBG for EJS ATOM (品目番号:SCM0910)	不要 ※WPIに含む	SSS サポート 1年契約 (SSS010)
RX600		WP DBG for EJS RX600 (品目番号:SCM4600)	Hot-Plug Adapter A (品目番号:CS2812)	
ARM		WP DBG for EJS ARM (品目番号:SCM0790)		
ARM マルチコア		WP DBG for EJS ARM MC (品目番号:SCM0791)		
ARM Cortex-M	本体+デバッグ (品目番号:SCD002J)			
ARM Cortex-M ETM	本体+デバッグ (品目番号:SCD003J)		不要 ※専用本体に含む	

※ 価格についてはお問い合わせください

お問い合わせ先